



苏州英飞思科学仪器有限公司

Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd



EDX-8800H MAX XRF Spectrometer

立式X荧光光谱仪

材料分析专家

Simply the Best

- > 美国AmpTek -FSDD探测器, 高分辨率高计数率
- > 真空测试环境提供最优轻元素检测效果
- > 无损元素分析涵盖11Na to 92U
- > 适应各种复杂矿物样品测试, 固体, 液体, 合金, 粉末和泥浆
- > 多组合滤光片系统, 有效提高微量元素检出限
- > 坚固的设计适用于各种复杂而严苛的现场工作环境



EDX8800H MAX操作简单，分析性能出色，同时还可拓展到以下应用

塑胶及有机物：塑料材料PE，PVC，添加剂等元素分析；

石油化工：燃料，润滑油监测，添加剂，磨损金属等中的硫元素分析；

环境：废水，空气污染，土壤和地面，排放控制等；

涂层厚度和薄膜：分析多层涂层，钢涂层，杂质等；

刑侦及公安：证据分析，材料匹配，爆炸物等

食品，化妆品和药品：添加剂控制，原材料，有害金属，包装材料等；

ESI英飞思EDX8800H MAX光谱仪主要应用于在采矿过程的所有阶段进行材料元素成分分析。从勘探样品到矿物精矿，从选矿到尾矿，EDX8800H MAX都在苛刻的采矿环境中均具有出色的灵活性，分析性能和稳定性。EDX8800H MAX专注于对地质材料的主量，微量和痕量元素进行定性和定量分析，其中包括：铁矿·铜矿·铝土矿·贵金属矿产·稀土矿·原料·磷酸盐·煤炭·铅锌矿·锰矿·镍矿·石灰石·粘土·石膏·玻璃·土壤·水泥·耐火材料及其他等

产品特点：

作为一款专业为矿产元素分析而设计和生产的光谱仪，EDX-8800H MAX兼顾了耐用性，易于操作和高性价比其显著优势主要有：

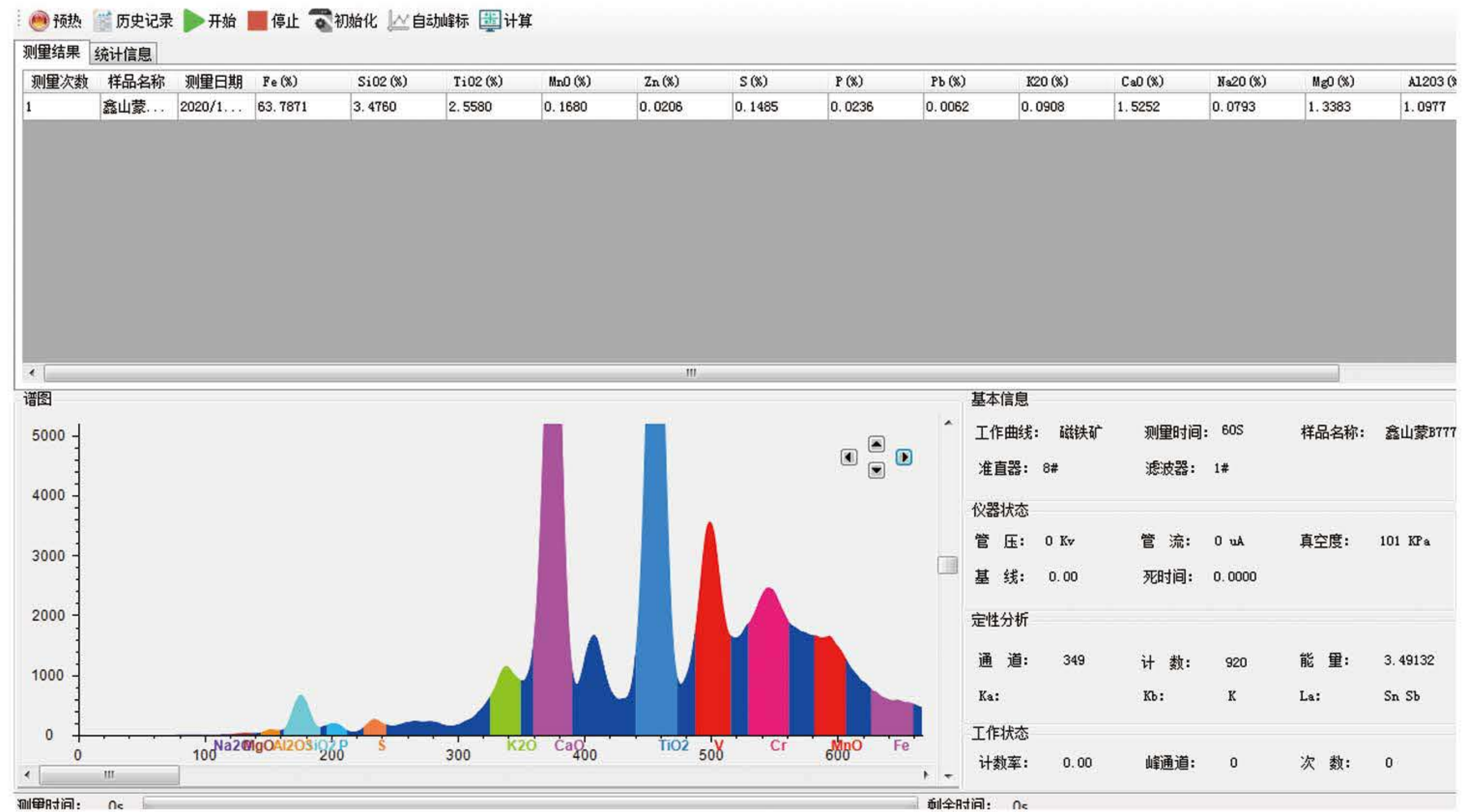
- 无需或者很少的样品制备，全程无损分析，一到三分钟即可出结果
- 强大的基于Windows的FP（基本参数算法）软件降低了基体效应的影响
- 原装进口高功率光管和电制冷的FSDD硅漂移检测器不仅具有出色的短期重复性和长期重现性，而且具有出色的元素峰分辨率
- 能同时进行元素和氧化物成分分析
- 多重仪器硬件保护系统，并可通过软件进行全程实时监控，让仪器工作更稳定、更安全
- 特别设计的光路和真空系统大大提高了轻元素(Na, Mg, Al, Si, P) 的测试灵敏度和准确性，同时在测试Cd,Pb,Cr,Hg,Br,Cl等其他元素的灵敏度和稳定性都有了明显的提高
- 友好的用户界面，可定制的分析报告，可一键打印测试报告，包括分析结果，样品信息，光谱信息和样品图像
- 八种光路准直系统，根据不同样品大小自动切换，亦可测试样品不同位置再求平均值，降低样品不均匀性造成的误差
- 高清内置摄像头，清晰地显示仪器所检测的样品部位

功能强大而界面友好的测试软件

界面清晰易用。选择方法并输入样品识别信息后即可开始测量。软件内核-基本参数法 (FP) 可轻松分析未知样品。EDX8800H MAX已在工厂预安装了软件并进行了数据标定, 客户运行软件即可立刻开始测试。

无需每天重复标定。强大的软件功能还提供了

- > 一键初始化仪器, 基体自动匹配
- > 自动定性, 半定量和定量分析, 不同样品测试谱图可实时对比
- > 光谱处理和校正, 去除双倍峰和逃逸峰干扰, 降低元素吸收增强效应影响
- > 光谱背景扣除, 有效提高微量元素检测精度
- > 可实时刷新测量结果
- > 简单的流程栏向导可帮助用户创建新的自定义标定曲线
- > 可定制化测试报告, 一键打印



铝土矿样品10次连续测试稳定性报告

样片	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	K ₂ O	CaO	TiO ₂	MnO	Fe ₂ O ₃
样片1	0.438	84.577	8.754	0.196	0.502	3.753	0.049	1.966
样片2	0.442	84.653	8.880	0.197	0.522	3.799	0.052	1.962
样片3	0.424	84.508	8.810	0.197	0.509	3.852	0.051	1.983
样片4	0.427	84.537	8.636	0.196	0.513	3.777	0.051	1.963
样片5	0.424	84.501	8.709	0.197	0.503	3.791	0.050	1.973
样片6	0.415	84.496	8.737	0.200	0.513	3.861	0.051	2.013
样片7	0.450	84.618	8.917	0.197	0.511	3.854	0.051	1.966
样片8	0.423	84.577	8.689	0.201	0.501	3.838	0.050	1.971
样片9	0.447	84.481	8.740	0.199	0.495	3.853	0.050	1.971
样片10	0.453	84.753	8.893	0.201	0.517	3.793	0.052	1.981
平均值	0.434	84.600	8.776	0.198	0.509	3.817	0.051	1.975
标准偏差	0.013	0.155	0.094	0.002	0.008	0.039	0.001	0.015
相对标准偏差	3.10%	0.18%	1.08%	0.97%	1.63%	1.02%	1.91%	0.76%

仪器参数	
仪器外观尺寸	650mm*600mm*900mm
仪器重量	105KG
元素分析范围	Na11-U92钠到铀
可分析含量范围	1ppm- 99.99%
探测器	AmpTek 超高分辨率电制冷FSDD硅漂移检测器
多通道分析器	4096道DPP analyzer
X 光管	原装进口高功率铍窗光管
高压发生装置	电压最大输出100kv, 自带电压过载保护
电压	220ACV 50/60HZ
环境温度	-10 ° C 到35 ° C
仪器标准配置	仪器可选配置
纯Au初始化标样	磨样机
真空泵	压片机
矿石专用样品杯	烘干箱
USB数据线	ESI-900型XRF专用全自动熔样机
电源线	电子秤
测试薄膜	矿石标准物质
仪器出厂和标定报告	交流净化稳压电源
保修卡	150目筛子



苏州英飞思科学仪器有限公司

Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd

地址：江苏省苏州工业园区唯新路69号一能科技园2幢407

电话：0512-68635865

全球官网：www.esi-xrf.com 中文官网：www.esi-xrf.cn

邮箱：sales@esi-xrf.com